

INFORMAZIONI PERSONALI



Giancarlo Pepponi

via Sabbioni, 11, Trento, 38123, Italy
 +39 0461 314491 +39 348 9377973
pepponi@fbk.eu
<https://sd.fbk.eu/en/crs/>

Sesso Maschio | Data di nascita 08/03/1974 | Nazionalità Italiano

ESPERIENZE LAVORATIVE

01.04.2022 - presente

Responsabile di unità

Fondazione Bruno Kessler, centro Sensors&Devices, unità Custom Radiation Sensors, CRS, via Sommarive, 18, 38123 Trento, Italia

■ Responsabile dell'Unità Custom Radiation sensor (CRS) del centro Sensors&Devices. Coordinamento di un team di oltre 15 ricercatori che lavorano allo sviluppo di sensori di radiazione in silicio con diverse tecnologie tra cui diodi p-i-n, rilevatori di strisce e pixel al silicio, diodi a valanga a basso guadagno (LGADs), fotomoltiplicatori al silicio (SiPMs), rilevatori di deriva del silicio (SDDs). Coordinamento del networking e relazioni: accordi di collaborazione, gestione IP. Coordinamento di progetti di ricerca. Gestione del budget. Contratti e appalti. Proposte di ricerca con finanziamento competitivo.

Micro-nano-fabbricazione, coordinamento di progetti e personale tecnico-scientifico

01.01.2018 – 31.03.2022

Responsabile Ricerca e Sviluppo

Fondazione Bruno Kessler, centro Sensors&Devices, unità Micro Nano Facility, MNF, via Sommarive, 18, 38123 Trento, Italia

■ Responsabile della Ricerca e Sviluppo della Micro-nano Characterization and Fabrication Facility, MNF. Coordinamento di progetti di ricerca. Acquisizione di attrezzature. Coordinamento di un team di oltre 15 ricercatori che lavorano in diverse aree di micro-nano-fabbricazione e caratterizzazione. Implementazione di procedure di qualità nelle attività di ricerca. Coordinamento del networking e delle relazioni: accordi di collaborazione, contratti, gestione IP.

Micro-nano-fabbricazione, analisi di materiali, coordinamento di progetti e personale tecnico-scientifico

01.01.2014 – 31.12.2017

Responsabile del gruppo caratterizzazione materiali

Fondazione Bruno Kessler, centro Sensors&Devices, unità Micro Nano Facility, MNF, via Sommarive, 18, 38123 Trento, Italia

■ Coordinatore del gruppo di caratterizzazione dei materiali del Micro-nano Characterization and Fabrication Facility, MNF. Coordinamento di progetti di ricerca. Acquisizione di attrezzature. Coordinamento di un team di oltre 5 ricercatori esperti in diverse tecniche analitiche (XPS, SIMS, XRF, XRD, SEM, EDX, EBSD, AFM). Implementazione di procedure di qualità nelle attività di caratterizzazione. Coordinamento del networking e delle relazioni: accordi di collaborazione, contratti, gestione IP.

Caratterizzazione di Micro- nano- materiali, pcoordinamento di progetti e personale tecnico-scientifico

01.12.2006 – 31.12.2013

Ricercatore scientifico

Fondazione Bruno Kessler
18, via Sommarive, Trento, 38123, Italy,

■ Responsabile delle attività di caratterizzazione materiali con raggi X, ed in particolare Fluorescenza X.

Caratterizzazione di Micro- nano- materiali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14.06.2010 - 19.02.2011

Visiting scientist – Marie Curie Action Grant

CRISMAT, ENSICAEN, Caen , France

- Combinazione di Diffrazione X e Fluorescenza X per varie applicazioni nella scienza dei materiali
- Sviluppo del Materials Properties Database MPOD

Ottobre 1999 – Giugno 2003

Dr. techn. - equivalente a PhD (Mit Auszeichnung – con lode)

Technische Universität Wien - Vienna University of Technology, Vienna , Austria

- Fisica dei raggi X, Fluorescenza X
- Sviluppo strumentale, preparazione e conduzione di esperimenti presso diverse strutture di radiazione di sincrotrone (HASYLAB, SSRL, laboratorio Bessyl-PTB), analisi e interpretazione dei dati. Tesi di dottorato intitolata: "Synchrotron Radiation induced Total Reflection XRF Analysis applied to Material Science "

Ottobre 1993 – Giugno 1999

Laurea in Fisica (110/110 e lode)

Università degli Studi di Trento, Trento, Italia

- Laurea in Fisica, tesi in Fisica dei Raggi X.

Settembre 1991 – Maggio 1993

IB – diploma bilingue (Italiano, Inglese) (39/45)

Diploma di scuola superiore internazionale

Atlantic College - United World College of the Atlantic, Llantwit Major, Wales, UK

Scuola superiore per il conseguimento dell'International Baccalaureate (IB)

Ammissione con borsa di studio assegnata con bando competitivo.

PERSONAL SKILLS

Lingua Madre

Italiano

Altre lingue

Altre lingue, autovalutazione, livello europeo

	Comprensione		Conversazione		Scrittura
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
• Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
• Tedesco	C1	C1	B2	B1	B1
• Francese	B2	B3	B1	A3	A2

Competenze professionali

Transnational Access Manager del Progetto ANNA FP6, European Integrated Activity of Excellence and Networking for Nano and Micro-Electronic Analysis, Integrating Activity implementata come Integrated Infrastructure Initiative, Numero di contratto: RII3-CT-2006-026134

Competenze digitali

Programmazione e analisi dati scientifici con python, R, C

Altre competenze

Supervisione degli studenti, organizzazione di eventi scientifici, trasferimento tecnologico

ALTRE INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Autore and co-autore di oltre 110 articoli scientifici sottoposti a valutazione.

Per una lista completa vedere:

<https://orcid.org/0000-0002-7397-1946>

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601958776>

h-index (scholar 29. scopus 23)

Dieci pubblicazioni selezionate riguardanti le competenze sviluppate e attinenti al presente bando:

1. Perenzoni, Matteo; Ali, Muhammad; Pepponi, Giancarlo; Guidi, Vincenzo; A compact Current- and voltage-mode model of antenna-coupled FET terahertz detectors, IEEE Transactions on Electron Devices, 68, 2, 471-478, 2020, IEEE
2. Giuntini, Lorenzo; Castelli, Lisa; Massi, Mirko; Fedi, Mariaelena; Czelusniak, Caroline; Gelli, Nicola; Liccioli, Lucia; Giambi, Francesca; Ruberto, Chiara; Mazzinghi, Anna; Detectors and cultural heritage: The INFN-CHNet experience, Applied Sciences, 11, 8, 3462, 2021, MDPI
3. King, Pietro; Gugiatti, Matteo; Carminati, Marco; Buonanno, Luca; Borghi, G; Pepponi, G; Lechner, P; Siegmann, D; Urban, K; Houdy, T; Design and characterization of Kerberos: a 48-channel analog pulse processing and data acquisition platform, Journal of Instrumentation, 16, 07, T07007, 2021, IOP Publishing
4. Cirrincione, D; Antonelli, M; Aquilanti, G; Bellutti, P; Bertuccio, G; Borghi, G; Cautero, G; Ficorella, F; Gandola, M; Giuressi, D; A new collimated multichannel modular detection system based on Silicon Drift Detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 1049, 168118, 2023, Elsevier
5. Rachevski, A; Antonelli, M; Bellutti, P; Bonvicini, V; Borghi, G; Campana, R; Ceraudo, F; Cirrincione, D; Del Monte, E; Evangelista, Y; eXTP Large Area Detector: Qualification procedure of the mass production, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 1046, 167750, 2023, Elsevier
6. Carminati, Marco; Borghi, Giacomo; Demenev, Evgeny; Gugiatti, Matteo; Pepponi, Giancarlo; Crivellari, Michele; Ficorella, Francesco; Ronchin, Sabina; Zorzi, Nicola; Borovin, Evgeny; 32-Channel silicon strip detection module for combined X-ray fluorescence spectroscopy and X-ray diffractometry analysis, Frontiers in Physics, 10, 1-9, 2022
7. Feroci, Marco; Ambrosi, Giovanni; Ambrosino, Filippo; Antonelli, Matias; Argan, Andrea; Babinec, Viktor; Barbera, Marco; Bayer, Joerg; Bellutti, Pierluigi; Bertucci, Bruna; The large area detector onboard the eXTP mission, Space Telescopes and Instrumentation 2022: Ultraviolet to Gamma Ray, 12181, 466-483, 2022, SPIE
8. Merzi, Stefano; Acerbi, Fabio; Capasso, Massimo; Mazzi, Alberto; Paternoster, Giovanni; Pepponi, Giancarlo; Zorzi, Nicola; Gola, Alberto; Low-energy X-ray spectroscopy with RGB-HD SiPMs coupled to CsI (TI) scintillator, Journal of Instrumentation, 17, 11, P11007, 2022, IOP Publishing
9. Nicolaidis, Riccardo; Nozzoli, Francesco; Pepponi, Giancarlo; Bellutti, Pierluigi; Demenev, Evgeny; Follega, Francesco Maria; Iuppa, Roberto; Vilona, Veronica; The Low-Energy Module (LEM): Development of a CubeSat Spectrometer for Sub-MeV Particles and Gamma-Ray Burst Detection, Physical Sciences Forum, 7, 1, 21, 2023, MDPI
10. Hourdakis, E; Pepponi, G; Barozzi, M; Nassiopoulou, AG; Simple method for determining Si pn junction depth using anodization, Microelectronic Engineering, 244, 111558, 2021, Elsevier

Trento, 17.04.2023

